

Актуализированный перечень услуг ЦКП ИФМ РАН
по состоянию на 2017 год

	Наименование Услуги	Ед. изм.	Стоимость*, руб.
1.	Рентгеновский дифракционный анализ эпитаксиальных слоев (Bruker D8)	1 образец	5500
2.	Рентгеновский дифракционный анализ эпитаксиальных слоев $YBa_2Cu_3O_{7-d}$ (Bruker D8)	1 образец	5500
3.	Рентгеновский дифракционный анализ поликристаллических образцов (Bruker D8)	1 образец	5500
4.	Анализ тонких слоев методом рентгеновской рефлектометрии (Bruker D8)	1 образец	5500
5.	Определение отклонения среза кристаллических подложек (Bruker D8)	1 образец	5500
6.	Определение параметров многослойных зеркал с помощью рентгеновской рефлектометрии. (X'PERT)	1 образец	1300
7.	Определение параметров многослойных зеркал в диапазоне экстремального ультрафиолета (Стенд ИФМ)	1 образец	Договорная**
8.	Определение параметров многослойных зеркал в диапазоне мягкого рентгена (Стенд ИФМ)	1 образец	Договорная**
9.	Элементный анализ образцов с помощью энерго дисперсионного спектрометра (сканирующий электронный микроскоп SUPRA 50VP)	1 образец	6500
10.	Морфометрический анализ образцов с помощью растрового электронного микроскопа (SUPRA 50VP и NEON 40)	1 образец	12000
11.	Электронная литография с помощью сканирующего электронного микроскопа	1 образец	6500
12.	Нанолитография с помощью остро фокусированных ионных пучков (NEON 40)	1 образец	18000
13.	Подготовка образцов для исследования методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии с помощью остро фокусированных ионных пучков	1 образец	6000
14.	Анализ кристаллической структуры объектов методами просвечивающей электронной микроскопии (LIBRA 200 MC)	1 образец	50000
15.	Исследование состава и структуры образцов методом спектрометрии характеристических потерь электронов (LIBRA 200 MC)	1 образец	50000
16.	Анализ поверхности с помощью сканирующий зондовой микроскопии (NTEGRA Prima)	1 образец	2000

17.	Анализ поверхности с помощью интерферометра белого света (Talysurf)	1 образец	1000
18.	Послойный элементный анализ методом вторично-ионной масс-спектрометрии. (TOF.SIMS 5)	1 образец	20000
19.	Определение квантовой эффективности в кремниевых светоизлучающих структурах, легированных эрбием.	1 образец	
20.	Исследование спектров пропускания, фотопроводимости, люминесценции и стимулированного излучения полупроводниковых структур, кристаллов и диэлектрических материалов методом Фурье-спектроскопии.	1 образец	Договорная
21.	Измерение вольт-амперных характеристик сверхпроводящих мостиков и джозефсоновских переходов	1 образец	2000
22.	Измерение транспортных (осцилляции Шубникова - де Гааза) и оптических в терагерцовом диапазоне (фотопроводимость, циклотронный резонанс) характеристик гетероструктур при низких температурах	1 образец	12000

* - в расчете на 1 образец, стандартный для данной методики, без учета подготовки образцов, с учетом НДС 18%. В случае нестандартных образцов, где требуется доработка методики, работы ведутся в форме договора на выполнение НИР.

** - для этих услуг в настоящее время не выработаны требования к «стандартному» образцу, поэтому работы ведутся в форме договора на выполнение НИР.

Руководитель ЦКП
д.ф.-м.н., профессор

 В.И.Шашкин